一酸化炭素からの単層カーボンナノチューブ合成に与える Co/Mo 比の影響
Influence of the Co/Mo Ratio on the Single-walled Carbon Nanotube Synthesis from Carbon Monoxide

○西井 俊明(電源開発,東大院) 正 村上 陽一(東大院) 野田 優(東大院)
杉目 恒志(東大院) 桝山 直人(電源開発) 正 丸山 茂夫(東大院)
Toshiaki Nishii<sup>1,2</sup>, Yoichi Murakami<sup>2</sup>, Suguru Noda<sup>2</sup>, Hiroshi Sugime<sup>2</sup> and Shigeo Maruyama<sup>2</sup>
<sup>1</sup>Electric Power Development Co., Ltd., 1-9-88 Chigasaki, Chigasaki, Kanagawa 253-0041
<sup>2</sup>Dept. of Mech. Eng., the University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656

Co and Mo are often used as catalysts for the catalytic chemical vapor deposition (CCVD) synthesis of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) on a substrate. In this study, the influence of the Co/Mo ratio on the SWNT synthesis from carbon monoxide under atmospheric pressure was evaluated by the combinatorial method, using a library of sputter-doposited Co and Mo patterns.

Key Words: SWNT, COCCVD, Combinatorial Method (9 point)

## 1. はじめに

**1993**年の Iijima と Ichihashi<sup>(1)</sup>による単層カーボンナノチ ューブ(SWNT)の発見以来,その量産技術や用途に関する研 究が活発化している.

筆者らは、量産を念頭に CO を主体とする石炭ガス化ガ スやCO<sub>2</sub>を主体とする石炭燃焼ガスからのSWNT等のナノ 炭素合成に関わる研究を行っており、アルコールを原料と する CCVD(ACCVD)法<sup>(2)</sup>で実績のある石英基板上にディッ プコートした Co/Mo 触媒を用い、CO からの石英基板上へ の SWNT 合成に成功した<sup>(3)</sup>. この COCCVD 法で、石英基 板に対する Co/Mo 触媒のディップコート条件を変えるこ とによって、SWNT を基板に対して垂直あるいは水平に配 向させることにも成功し、実用化に向けて再現性を高める ための取組みを行っている.

極微量の Co/Mo 触媒を基板上にディップコートする場合 Co/Mo 比を厳格に制御することが困難であり,これが再現性悪化の一因とも考えられる. そこで,本報では,スパッタリングで Si 基板上の Co または Mo の濃度を傾斜させたコンビナトリアル法<sup>(4)</sup>を用い, SWNT 成長に与える Co/Mo 比の影響を正確に評価した.

# 2 実験方法

20mm×20mm×0.5mm の酸化膜付 Si 基板上に, Co および Mo を直交方向に濃度を傾斜させてスパッタリングしたも のを触媒とした.これを Fig.1 に示すように半分に切断し, 石英管(内径 19mm, 長さ 1m)内に設置し, CO および H<sub>2</sub>(純 度約 100%)の 1:1 混合ガスを 1000sccm 通気して, 常圧, 800℃で 120min 間の COCCVD を行った.

# 3. 結果

### 3.1 モルフォロジー

COCCVD後のSi基板表面の概観を,Fig.1に示す.図中の+印は,電子顕微鏡観察とRaman散乱分光分析を行った位置である.

電子顕微鏡観察(Hitachi S-4700,加速電圧 1keV)を行った ところ,図中で枠を施した領域(S)で SWNT の生成が確認 された.これよりも Co 濃度が濃い領域(AM)では不定形炭 素や多層カーボンナノチューブ(MWNT)が確認され,逆に Co が薄い領域(N)では生成物は確認されなかった.図中の 検査線(X)-(Y)に沿った観察で得られた二次電子像を,Fig.2 に示す.



3.2 Raman 散乱スペクトル

Fig.1 中の検査線(X)-(Y)に沿った Raman 散乱分光分析 (Horiba-JovinYvon HR800, レーザー励起線 488nm, レーザ 一強度 1mW)から得られたスペクトルを, Fig.3 に示す. 領 域 S では, グラフェンの欠陥由来の D-band(1350cm<sup>-1</sup>付近) に対し, グラフェンの sp2 結合由来の G-band(1590cm<sup>-1</sup>付近) のピーク強度が著しく高く, 200cm<sup>-1</sup> 以下の波数帯には SWNT 特有の RBM(Radial Breathing Mode)ピークも現れて いる. 一方, 領域 AM では, G-band と D-band が現れてい るが, R 値(G-band に対する D-band の強度比)が領域 S に比 べ著しく高く, 結晶性の低い炭素が生成していることが判 る.

Fig.1 中の全分析点に対するスペクトルより求めた, Si 基板由来のピーク(520cm<sup>-1</sup>付近)に対する G-band の強度比 I<sub>Gn</sub>とR 値の分布を, Fig.4 に示す. 図中, Fig.1 同様に電子 顕微鏡観察より SWNT の生成が確認された領域に枠を施 した.



Fig.2 Surface Morphology of the Specimen



Fig.3 Raman Scattering Spectra through theLine (X)-(Y)

#### 4. 考察

電子顕微鏡観察で SWNT 生成が確認された領域と, Raman 散乱スペクトルから得られた R 値が低くかつ I<sub>Gn</sub>が 高い領域を真の SWNT 生成域とし, Fig.4 にこれらの境界 線を示した.

同図によると, SWNT の生成は Mo に比べ Co の濃度に 敏感であることが判る.また, Mo 濃度が 20atom/nm<sup>2</sup>以下 の場合, SWNT が生成する Co 濃度は Mo 濃度に比例し (Co/Mo 比 3.12~6.25), Mo 濃度が 20atom/nm<sup>2</sup>以上の場合 Co 濃度は Mo 濃度に依存せず 150~300atom/nm<sup>2</sup>であるこ とが判った.

Si 基板上にスパッタリングされた Co および Mo は,そ の後大気中で自然酸化される.基板上に成膜された遷移金 属触媒で SWNT を CCVD 成長させる場合,高温場で触媒 クラスタの大きさを SWNT の直径相当に維持する必要が ある. Co/Mo 二元触媒場合, Mo 酸化物あるいは CoMo 酸 化物が,SWNT 成長に有効なクラスタ(以下「有効クラス タ」と呼ぶ.)の側面または有効クラスタと基板の間に配置 され,高温下での有効クラスタの凝集・粗大化を抑制する バインダ(以下「バインダ」と呼ぶ.)の役割を果たすこと が判っている<sup>(5)</sup>.

そこで、Si 基板上にスパッタリングした Co および Mo について次のように考えた. 触媒濃度が薄ければ有効クラ スタは基板上で二次元的に広がり、CCVD 中の凝集・粗大 化を抑制するには有効クラスタ側面にバインダが配置され る必要があり、Co と Mo の割合が一定であることが要求さ れる. 触媒濃度が濃くなると、やがて基板表面全体に有効 クラスタとバインダからなる単原子層が形成され、その後 三次元的に成長を始める. 三次元成長が開始されると、既 に基板との間にバインダが存在し、これら第一層中のバイ ンダの割合がその上に積層するクラスタを高温下で固定す るに十分である場合、上層に飛来するクラスタに見合った 量のバインダは不要となる.

よって,前述の Mo 濃度 20atom/nm<sup>2</sup>は,第一層中のバインダの割合に対応する臨界値と推察した.また, CCVD のガス種によって触媒微粒子の融点が変わるため,この臨界値は原料ガス組成によっても変化すると考えられる.

#### 5. おわりに

スパッタリングで Si 基板上の Co または Mo の濃度を傾 斜させたコンビナトリアル法<sup>(4)</sup>を用い, COCCVD による SWNT 成長に与える Co/Mo 比の影響を評価した.

この結果, 基板上の Mo 濃度が 20atom/nm<sup>2</sup>以下の場合, SWNT が生成する Co 濃度は Mo 濃度に比例し(Co/Mo 原子 比 3.12~6.25), Mo 濃度が 20atom/nm<sup>2</sup>以上の場合 Co 濃度 は Mo 濃度に依存せず 150~300atom/nm<sup>2</sup>であることが判っ た.



Fig.4 Map of IGn and R from the Raman Scattering Spectroscopic Analysis

#### 参考文献

- (1) Iijima, S. et al., Nature, 363 (1993), 603.
- (2) Murakami, Y. et al., Chem. Phys. Lett., 377 (2003), 49.
- (3) Nishii, T. et al., 6th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, April 17-21, (2005), Matsushima, Miyagi, Japan.
- (4) Noda, S. Et al., Appl. Phys. Lett., 86 (2005)173106.
- (5) Hu, M. et al., J. Catal., 225 (2004), 230.